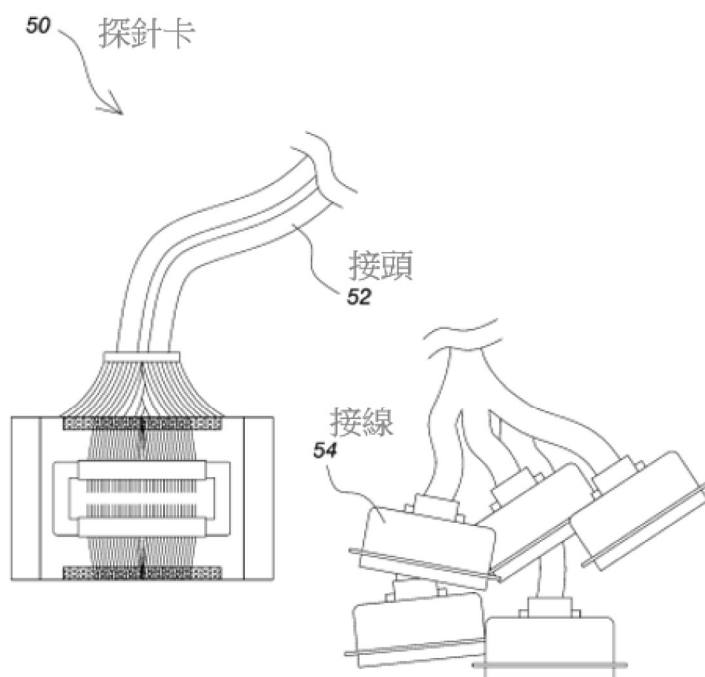
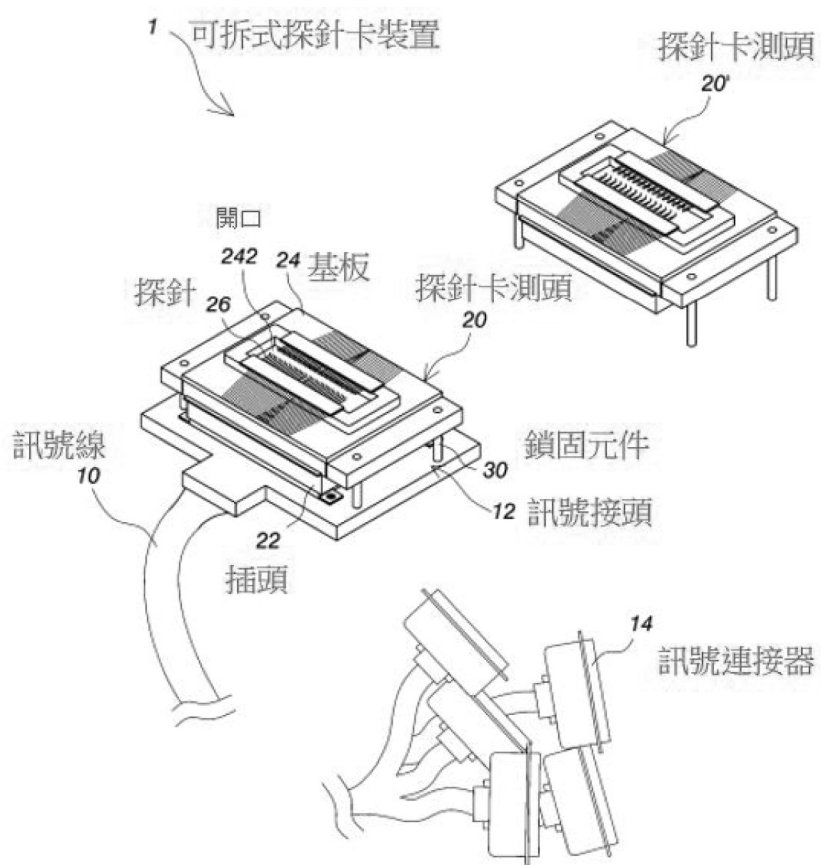


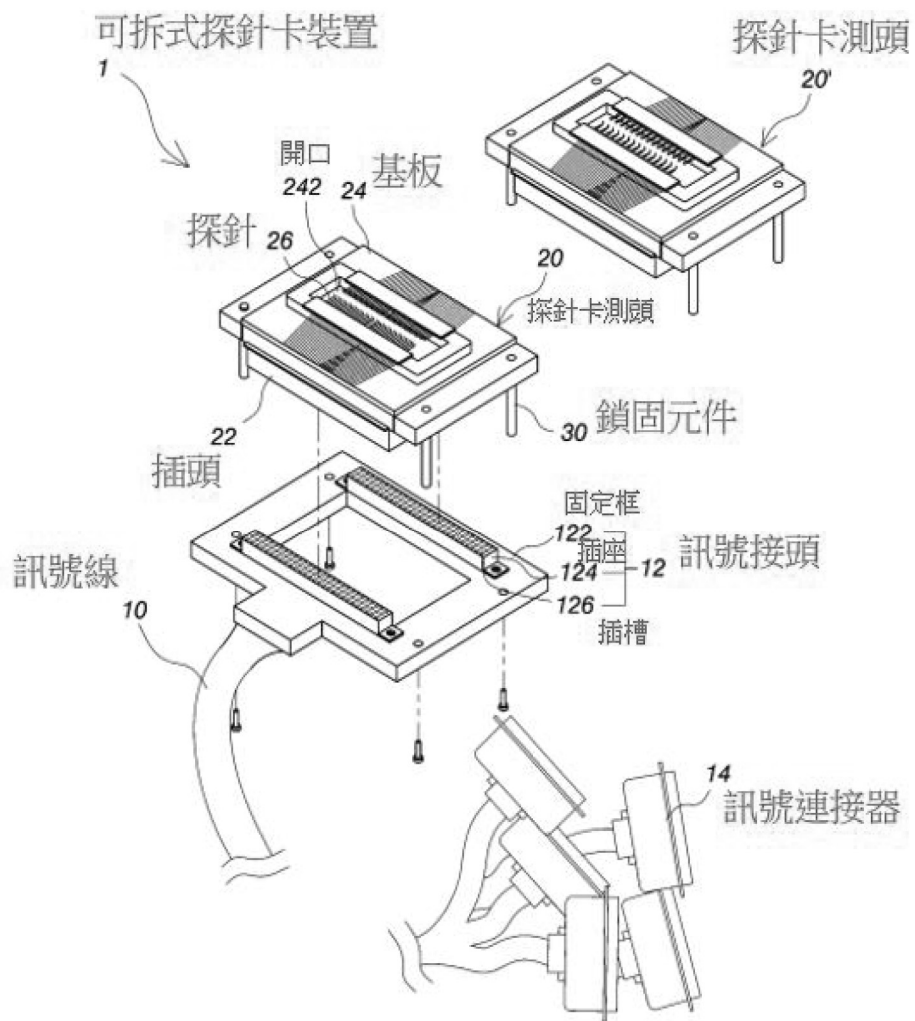
附件一：系爭專利主要圖式



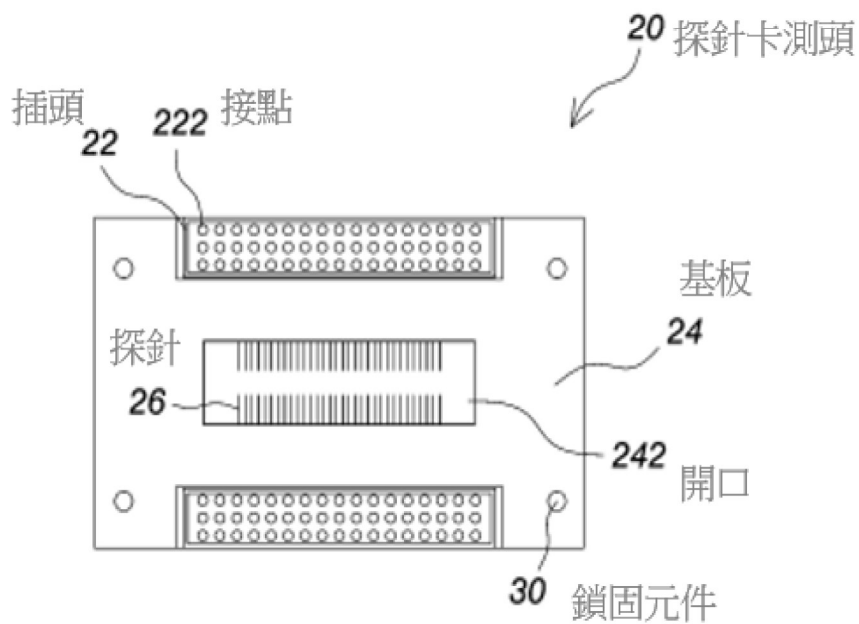
第一圖為習知探針卡立體示意圖。



第二圖為系爭專利之立體示意圖。



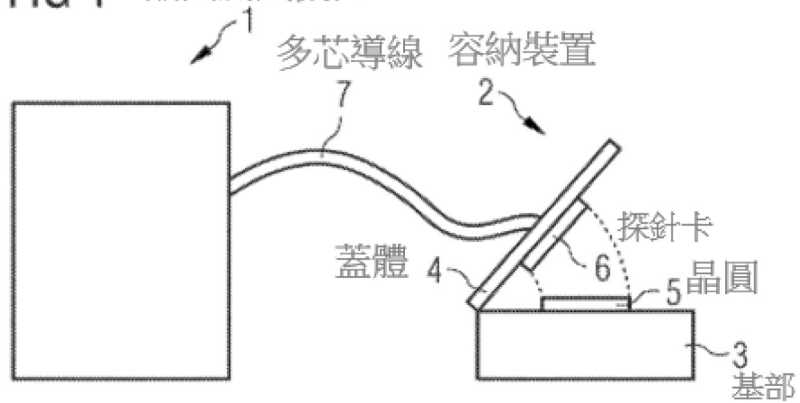
第三圖為系爭專利之元件分解圖。



第四圖為系爭專利之探針卡測頭仰視圖。

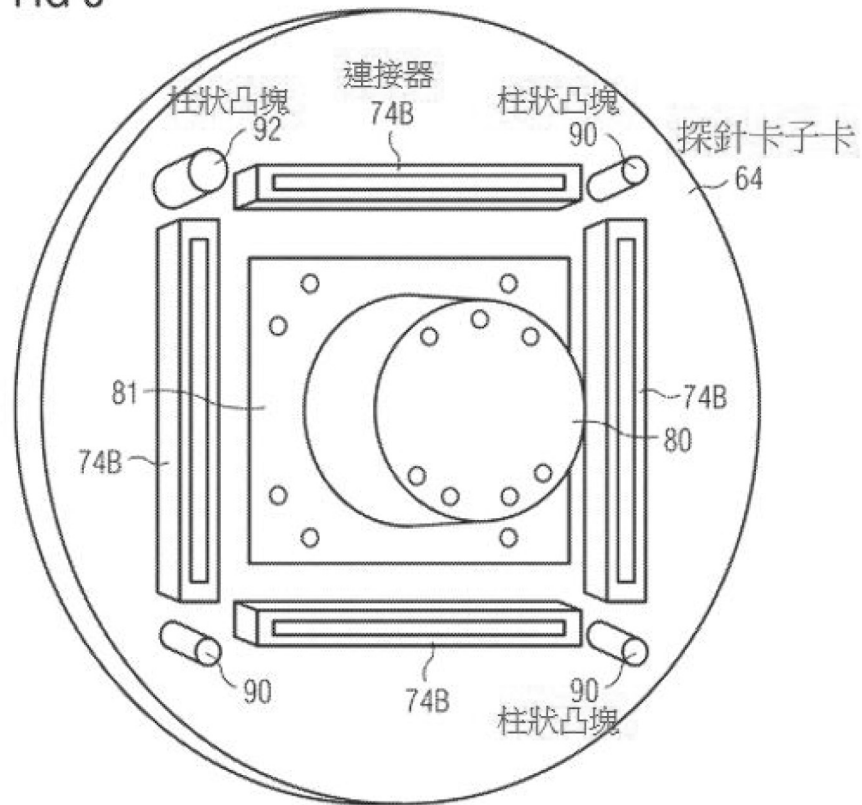
附件二：證據 2 主要圖式

FIG 1 晶圓測試機台



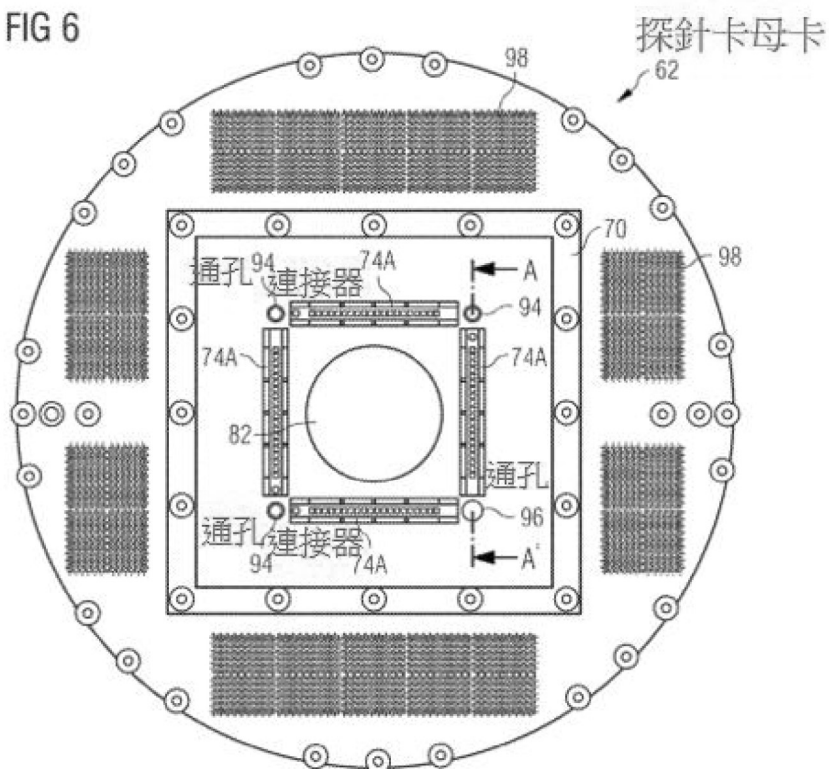
證據 2 圖 1 為包括測試夾具的晶圓測試器，其中容納有晶圓和探針卡。

FIG 5



證據 2 圖 5 為第三實施例的子卡立體圖。

FIG 6



證據 2 圖 6 為第三實施例的母卡平面圖。

FIG 7A

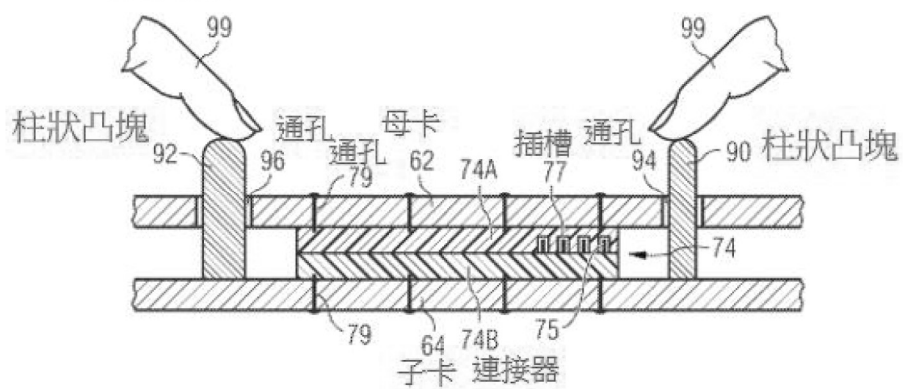
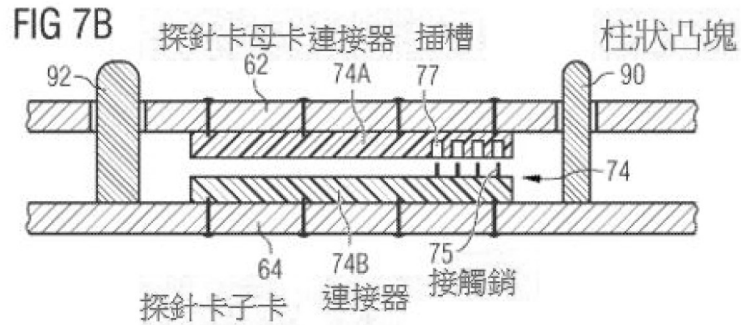


FIG 7B



證據 2 圖 7A 和 7B 為圖 6 中的線 A-A' 的剖視圖。